

| Symbol | Typ | Titel |
|-------------------|-----------------------|---|
| G | Sektion | Sektion G – Physik |
| G01 | Klasse | Messen; Prüfen |
| G01Q | Unterkategorie | Rastersondentechniken oder Vorrichtungen hierfür; Anwendung von Rastersondentechniken, z.B. Rastersondenmikroskopie [Scanning-Probe Microscopy = SPM] [2010.01] |
| G01Q 10/00 | Hauptgruppe | Abtastanordnungen oder Positionieranordnungen, d.h. Anordnungen zur aktiven Steuerung der Bewegung oder der Position der Sonde [2010.01] |
| G01Q 10/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Grobes Abtasten (Scannen) oder Positionieren [2010.01] |
| G01Q 10/04 | 1-Punkt Untergruppe | . Feines Abtasten (Scannen) oder Positionieren [2010.01] |
| G01Q 10/06 | 2-Punkt Untergruppe | .. Schaltungen oder Algorithmen hierfür [2010.01] |
| G01Q 20/00 | Hauptgruppe | Überwachung der Bewegung oder der Position der Sonde [2010.01] |
| G01Q 20/02 | 1-Punkt Untergruppe | . durch optische Mittel [2010.01] |
| G01Q 20/04 | 1-Punkt Untergruppe | . Selbst-detektierende Sonden, d.h. die Sonde selbst erzeugt ein für ihre Position repräsentatives Signal, z.B. piezoelektrische Sensoren [2010.01] |
| G01Q 30/00 | Hauptgruppe | Hilfsmittel zur Unterstützung oder Verbesserung von Rastersondentechniken oder Rastersondenvorrichtungen, z.B. Anzeige- oder Datenverarbeitungseinrichtungen [2010.01] |
| G01Q 30/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Nicht-SPM Analyseeinrichtungen, z.B. Rasterelektronenmikroskope [Scanning Electron Microscope = SEM], Spektrometer oder optische Mikroskope [2010.01] |
| G01Q 30/04 | 1-Punkt Untergruppe | . Anzeige- oder Datenverarbeitungseinrichtungen [2010.01] |
| G01Q 30/06 | 2-Punkt Untergruppe | .. zur Fehlerkompensation [2010.01] |
| G01Q 30/08 | 1-Punkt Untergruppe | . Mittel zum Schaffen oder Einstellen einer gewünschten Umgebungsbedingung innerhalb einer Probenkammer [2010.01] |
| G01Q 30/10 | 2-Punkt Untergruppe | .. thermische Umgebung [2010.01] |
| G01Q 30/12 | 2-Punkt Untergruppe | .. fluide Umgebung [2010.01] |
| G01Q 30/14 | 3-Punkt Untergruppe | ... flüssige Umgebung [2010.01] |
| G01Q 30/16 | 2-Punkt Untergruppe | .. Vakuumumgebung [2010.01] |
| G01Q 30/18 | 1-Punkt Untergruppe | . Mittel zum Schützen oder Isolieren des Inneren einer Probenkammer vor äußeren Umgebungsbedingungen oder Umgebungseinflüssen, z.B. Schwingungen oder elektromagnetischen Feldern [2010.01] |
| G01Q 30/20 | 1-Punkt Untergruppe | . Vorrichtungen oder Verfahren für die Probenhandhabung [2010.01] |
| G01Q 40/00 | Hauptgruppe | Kalibrierung, z.B. von Sonden [2010.01] |
| G01Q 40/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Kalibrierstandards und Verfahren zu deren Herstellung [2010.01] |
| G01Q 60/00 | Hauptgruppe | Besondere Arten der Rastersondenmikroskopie [SPM] oder Vorrichtungen hierfür; wesentliche Bestandteile hiervon [2010.01] |
| G01Q 60/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Kombinierte SPM-Methoden, die zwei oder mehr SPM-Techniken umfassen [2010.01] |
| G01Q 60/04 | 2-Punkt Untergruppe | .. Rastertunnel-Mikroskopie [Scanning Tunnelling Microscopy = STM] in Kombination mit Kraftmikroskopie [Atomic Force Microscopy = AFM] [2010.01] |
| G01Q 60/06 | 2-Punkt Untergruppe | .. optische Rasternahfeldmikroskopie [Scanning Near-field Optical Microscopy = SNOM] in Kombination mit Kraftmikroskopie [Atomic Force Microscopy = AFM] [2010.01] |

| Symbol | Typ | Titel |
|-------------------|---------------------|--|
| G01Q 60/08 | 2-Punkt Untergruppe | ... Magnetkraftmikroskopie [Magnetic Force Microscopy = MFM] in Kombination mit Kraftmikroskopie [Atomic Force Microscopy = AFM] [2010.01] |
| G01Q 60/10 | 1-Punkt Untergruppe | . Rastertunnel-Mikroskopie [Scanning Tunnelling Microscopy = STM] und Vorrichtungen hierfür, z.B. STM-Sonden [2010.01] |
| G01Q 60/12 | 2-Punkt Untergruppe | ... Rastertunnel-Spektroskopie [Scanning Tunnelling Spectroscopy = STS] [2010.01] |
| G01Q 60/14 | 2-Punkt Untergruppe | ... Rastertunnel-Potentiometrie [Scanning Tunnelling Potentiometry = STP] [2010.01] |
| G01Q 60/16 | 2-Punkt Untergruppe | ... Sonden, deren Herstellung und zugehörige Geräte, z.B. Halterungen [2010.01] |
| G01Q 60/18 | 1-Punkt Untergruppe | . optische Rasternahfeldmikroskopie [Scanning Near-Field Optical Microscopy = SNOM] und Vorrichtungen hierfür, z.B. SNOM-Sonden [2010.01] |
| G01Q 60/20 | 2-Punkt Untergruppe | ... Fluoreszenz [2010.01] |
| G01Q 60/22 | 2-Punkt Untergruppe | ... Sonden, deren Herstellung und zugehörige Geräte, z.B. Halterungen [2010.01] |
| G01Q 60/24 | 1-Punkt Untergruppe | . Kraftmikroskopie [Atomic Force Microscopy = AFM] und Vorrichtungen hierfür, z.B. AFM-Sonden [2010.01] |
| G01Q 60/26 | 2-Punkt Untergruppe | ... Reibungskraft-Mikroskopie [2010.01] |
| G01Q 60/28 | 2-Punkt Untergruppe | ... Adhäsionskraft-Mikroskopie [2010.01] |
| G01Q 60/30 | 2-Punkt Untergruppe | ... Potential-Rastermikroskopie [2010.01] |
| G01Q 60/32 | 2-Punkt Untergruppe | ... AC-Modus [2010.01] |
| G01Q 60/34 | 3-Punkt Untergruppe | ... Tapping-Modus [2010.01] |
| G01Q 60/36 | 2-Punkt Untergruppe | ... DC-Modus [2010.01] |
| G01Q 60/38 | 2-Punkt Untergruppe | ... Sonden, deren Herstellung und zugehörige Geräte, z.B. Halterungen [2010.01] |
| G01Q 60/40 | 3-Punkt Untergruppe | ... Leitfähige Sonden [2010.01] |
| G01Q 60/42 | 3-Punkt Untergruppe | ... Funktionalisierung [2010.01] |
| G01Q 60/44 | 1-Punkt Untergruppe | . Ionenleitfähigkeits-Rastermikroskopie [Scanning Ion-Conductance Microscopy = SICM] und Vorrichtungen hierfür, z.B. SICM-Sonden [2010.01] |
| G01Q 60/46 | 1-Punkt Untergruppe | . Kapazitätsrastermikroskopie [Scanning Capacitance Microscopy = SCM] und Vorrichtungen hierfür, z.B. SCM-Sonden [2010.01] |
| G01Q 60/48 | 2-Punkt Untergruppe | ... Sonden, deren Herstellung und zugehörige Geräte, z.B. Halterungen [2010.01] |
| G01Q 60/50 | 1-Punkt Untergruppe | . Magnetkraftmikroskopie [Magnetic Force Microscopy = MFM] und Vorrichtungen hierfür, z.B. MFM-Sonden [2010.01] |
| G01Q 60/52 | 2-Punkt Untergruppe | ... Resonanz [2010.01] |
| G01Q 60/54 | 2-Punkt Untergruppe | ... Sonden, deren Herstellung und zugehörige Geräte, z.B. Halterungen [2010.01] |
| G01Q 60/56 | 3-Punkt Untergruppe | ... Sonden mit magnetischer Beschichtung [2010.01] |
| G01Q 60/58 | 1-Punkt Untergruppe | . thermische Rastermikroskopie [Scanning Thermal Microscopy = SThM] und Vorrichtungen hierfür, z.B. SThM-Sonden [2010.01] |
| G01Q 60/60 | 1-Punkt Untergruppe | . elektrochemische Rastermikroskopie [Scanning Electro-Chemical Microscopy = SECM] und Vorrichtungen hierfür, z.B. SECM-Sonden [2010.01] |
| G01Q 70/00 | Hauptgruppe | Allgemeine Aspekte zu SPM-Sonden, deren Herstellung und zugehörigen Geräten, sofern sie nicht besonders für eine einzelne der SPM-Techniken unter G01Q 60/00 ausgebildet sind [2010.01] |

| Symbol | Typ | Titel |
|-------------------|---------------------|--|
| G01Q 70/02 | 1-Punkt Untergruppe | . Sondenhalterungen [2010.01] |
| G01Q 70/04 | 2-Punkt Untergruppe | ... mit Kompensation für temperatur- oder schwingungsinduzierte Fehler [2010.01] |
| G01Q 70/06 | 1-Punkt Untergruppe | . Arrays von Sondenspitzen [2010.01] |
| G01Q 70/08 | 1-Punkt Untergruppe | . Sondencharakteristik [2010.01] |
| G01Q 70/10 | 2-Punkt Untergruppe | ... Form und Konizität [2010.01] |
| G01Q 70/12 | 3-Punkt Untergruppe | ... Nanoröhrchen-Spitzen [2010.01] |
| G01Q 70/14 | 2-Punkt Untergruppe | ... besondere Materialien [2010.01] |
| G01Q 70/16 | 1-Punkt Untergruppe | . Sondenherstellung [2010.01] |
| G01Q 70/18 | 2-Punkt Untergruppe | ... Funktionalisierung [2010.01] |
| G01Q 80/00 | Hauptgruppe | Anwendungen von anderen Rastersondentechniken als SPM (Herstellung oder Behandlung von Mikrostrukturen B81C; Herstellung oder Behandlung von Nanostrukturen B82B 3/00; Aufzeichnen oder Wiedergabe von Information mittels Nahfeldwechselwirkung G11B 9/12, G11B 11/24 oder G11B 13/08) [2010.01] |
| G01Q 90/00 | Hauptgruppe | Rastersondentechniken und Rastersondenvorrichtungen soweit nicht anderweitig vorgesehen [2010.01] |